

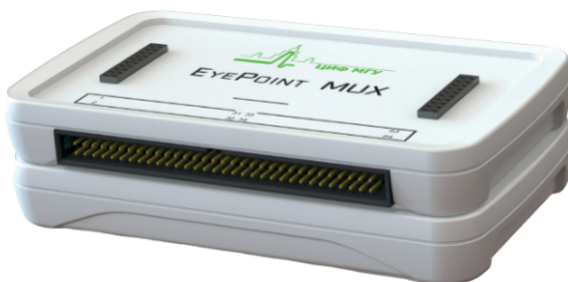
EYEPOINT MUX

Мультиплексор **EYEPOINT MUX** - устройство, позволяющее автоматизировать входной контроль микросхем и тестирование краевых разъемов печатных плат.

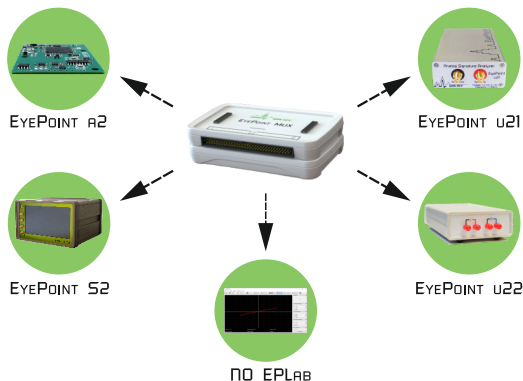
Предназначен для коммутирования одного входного канала на любой из выходных каналов в заданной оператором последовательности.

Состоит из материнской платы **EYEPOINT MUX_M** и подключаемых к ней модулей **EYEPOINT MUX_S_A**.

Работает совместно с измерителем и специализированной оснасткой.



Совместимость с линейкой EYEPOINT



Краткое описание частей мультиплексора

EYEPOINT MUX_M



Материнская плата мультиплексора,
необходимая для работы модулей
EYEPOINT MUX_S_A

Позволяет подключать
до 8 модулей на 64 канала

EYEPOINT MUX_S_A

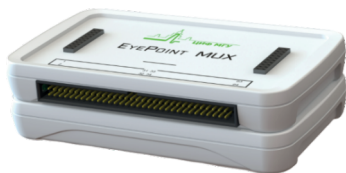


Модуль мультиплексора на 64 канала.
Подключение «один ко многим»

Позволяет зондировать каждый
из 64 каналов по отношению
к общему проводу

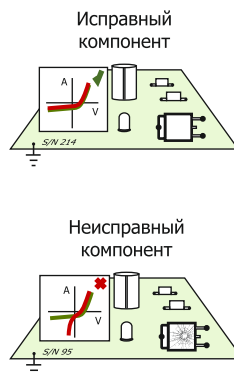
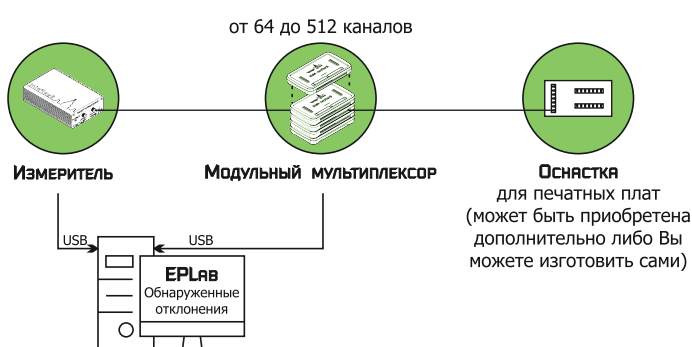
Скалирование модулей

Возможность соединения
модулей **EYEPOINT MUX**
для получения большего
количества выходных каналов



Максимальное количество
соединяемых модулей - **8 штук**,
что дает **512 каналов** на выходе

Тестирование печатных плат

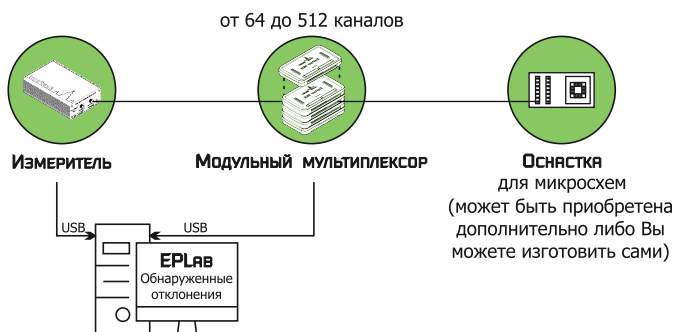


Введенные в отношении нашей страны санкции вызвали уход практически всех поставщиков электронных компонентов с рынка. Так как закупка новых компонентов стала ограничена, компаниям приходится чинить старые платы. Зачастую за счет отслуживших устройств. Поэтому в ходе ремонта важно не только выявить повреждения, которые нужно устранить, но и убедиться в исправности компонентов, планируемых для монтажа на плату.

Комплексная система на основе **EyePoint MUX** с помощью метода аналогового сигнатурного анализа позволяет автоматизировать обнаружение поврежденных электронных компонентов, а также выявление возможных неисправностей, таких как разрывы в цепи, непроай, выход из строя защитных диодов, повреждение входных/выходных цепей и т.д.

Благодаря входящему в комплект поставки ПО **EPLab** Вы получите отчет о выполненном тестировании с полным перечнем обнаруженных дефектов электронных компонентов.

Тестирование микросхем



Глобальная проблема современности - дефицит полупроводников. Вызванное этим повышение цен на чипы спровоцировало огромный приток контрафакта. Без специального оборудования выявить подделку практически невозможно, а использовать непроверенные микросхемы опасно. Что же делать, чтобы не нести серьезные убытки?

Разработанная в ЦИФ МГУ комплексная система для тестирования микросхем на основе **EyePoint MUX** позволит проверить состояние чипов и выполнить входной контроль, выявляя контрафактные и перемаркированные чипы до того, как они будут использованы в серийном производстве, а входящее в комплект поставки ПО **EPLab** предоставит отчет о выполненном тестировании.



Страница EYEPOINT MUX
на нашем сайте physlab.ru

ООО «ЦИФ МГУ имени М.В. Ломоносова»
119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 5, стр. 1
Телефон: +7 (499) 343-56-24 e-mail: info@physlab.ru
physlab.ru